

P-MEC Japan (医薬品原料 機器・装置展) 出展のお知らせ

名 称 : P-MEC Japan (医薬品原料 機器・装置展)

会 期 : 2018年4月18日(水)~20日(金) 10:00~17:00

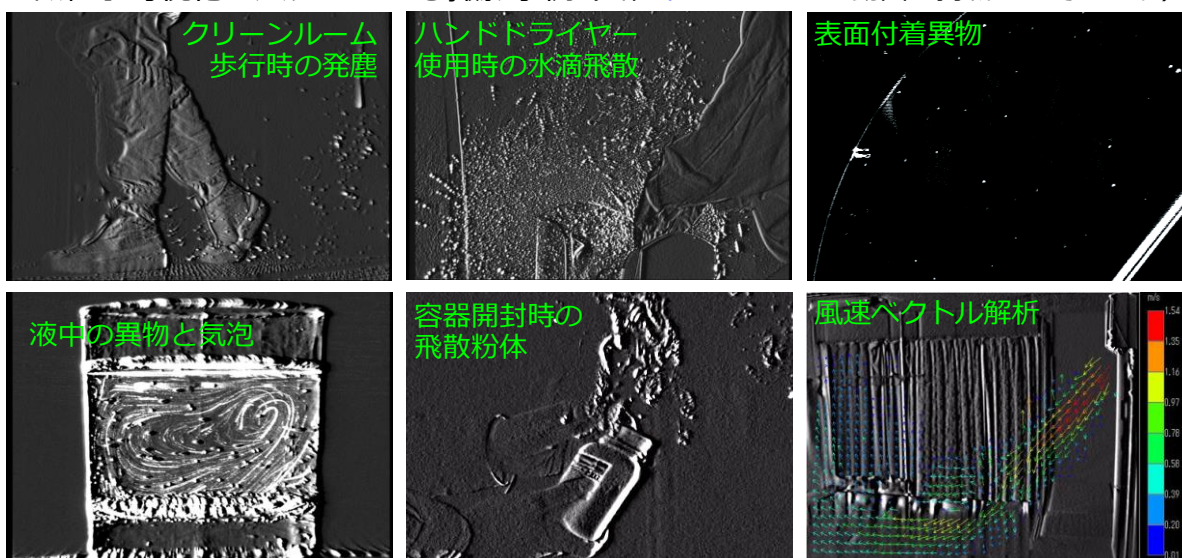
出展場所 : 東京ビッグサイト(東京都江東区) 東1ホール No. U-38

H P : <http://www.cphi-japan.com/info/p-mec.html> ※HPにて来場事前登録[無料]ができます

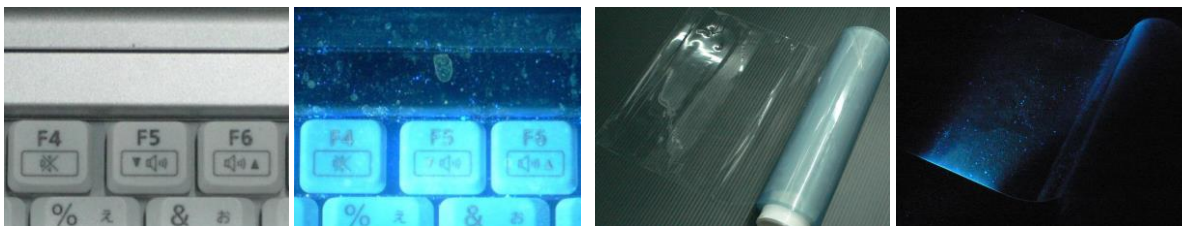


～ 世界最高水準の「微粒子可視化システム」を出展します ～

微粒子可視化システムによる撮影事例(当社ホームページに動画が掲載されています)



表面に付着した異物を識別観察する、これまでにないタイプの可視化ツールもあります



キーボード表面の異物

フィルム表面の異物

自社ブランド「ViEST®」として展開している当社の微粒子可視化技術は、80ナノメートルの浮遊粒子をリアルタイムに映像化できる世界最高水準の撮影感度をもった可視化技術です。

可視化システムの販売やシステムを利用した受託評価サービス(生産工程・製造装置内外・工場環境など)における微粒子や気流の挙動調査、商品の性能評価などを国内外で展開しています。

本展では、可視化システムや撮影事例動画を展示し、微粒子可視化のデモンストレーションも実施いたします。また、前年度販売を開始した新商品数点もすべて展示します。どれも手にとって確認することができます。

当社の高感度な微粒子可視化技術を是非会場でご体感ください。

<本件に関する問い合わせ先>

ビジュアルソリューション事業部 Tel: 03-3639-2206 E-mail: viest@snk.co.jp

～ 詳しくはホームページをご覧ください <http://www.snk.co.jp/particle> ～